



ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク

認 定 証

ペリージョンソン ラボラトリーアクレディテーション インクは、
下記の試験所を審査しました。

オルティカテクニカルソリューション 株式会社

〒194-0011 東京都町田市成瀬が丘 2-27-1

ここに本組織が、以下の認知された国際規格に基づき、認定されたことを証します。

ISO/IEC 17025:2017

本認定により、以下の範囲及び試験所品質マネジメントシステムの運営における技術的能力を
実証するものとします。(2017年4月発行 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケに準ずる)

直流電圧・交流電圧測定装置及び直流電圧・交流電圧発生装置による電氣的校正
(詳細は付属書に記述)

上記試験及び/又は校正サービスに対する認定資格は本認定証内で言及された住所のみを対象とする。本認定は、
上記規格の認定を管理するシステム規定に従い授与され、組織はその規定を遵守し、認定機関の任務を尊重する
ことをここに誓約する。

PJLA

初回認定日
2010年9月16日

発行日
2021年9月13日

認定証有効期限
2023年12月31日

認定番号
68090

認定証番号
L21-544

トレーシー サーツェン
プレジデント
Perry Johnson Laboratory
Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325
Troy, Michigan 48084

この認定証の有効性は、持続された認定に基づき継続審査を通じて維持されています。
PJLA ウェブサイト (www.pjlabs.com) でご確認ください。

尚、本認定証は日本語翻訳版であり、英文の認定証を正式のものとする。



認定証付属書

オルティカテクニカルソリューション株式会社

〒194-0011 東京都町田市成瀬が丘 2-27-1

田代 美弘 Tel: 042-706-0775

本認定を、上記組織の実施する下記校正について授与する。

電気的校正

校正を受けた機器、計量または計測器	範囲または必要に応じて基準装備サイズ	不確かさとして表現された校正測定能力 (+/-)	使用される校正機器および参照標準
直流電圧発生装置 ^F	1.1 μ V ~ 100 mV	11 μ V/V + 1.1 μ V	直流電圧発生装置校正 マニュアル(CQA1-02) による校正 Keysight Technologies 3458A
	100 mV ~ 1 V	6 μ V/V + 6 μ V	
	1 V ~ 10 V	6 μ V/V + 60 μ V	
	10 V ~ 100 V	8 μ V/V + 800 μ V	
	100 V ~ 1000 V	22 μ V/V + 2.2 $\times 10^4$ μ V	
直流電圧測定装置 ^F	1.5 μ V ~ 100 mV	15 μ V/V + 1.5 μ V	直流電圧測定装置校正 マニュアル(CQA1-01) による校正 Fluke 5700A
	100 mV ~ 1 V	9 μ V/V + 9 μ V	
	1 V ~ 10 V	9 μ V/V + 90 μ V	
	10 V ~ 100 V	10 μ V/V + 1.0 $\times 10^3$ μ V	
	100 V ~ 1000 V	11 μ V/V + 1.1 $\times 10^4$ μ V	
交流電圧発生装置 ^F			交流電圧発生装置校正 マニュアル(CQA1-09) による校正 Keysight Technologies 3458A
1kHz	0.030 mV ~ 100 mV	310 μ V/V + 0.031 mV	
1kHz	100 mV ~ 1 V	240 μ V/V + 0.24 mV	
50Hz	1 V ~ 10 V	180 μ V/V + 1.8 mV	
60Hz	1 V ~ 10 V	180 μ V/V + 1.8 mV	
400Hz	1 V ~ 10 V	170 μ V/V + 1.7 mV	
1kHz	1 V ~ 10 V	240 μ V/V + 2.4 mV	
20kHz	1 V ~ 10 V	410 μ V/V + 4.1 mV	
1kHz	10 V ~ 100 V	300 μ V/V + 30 mV	
1kHz	100 V ~ 600 V	770 μ V/V + 460 mV	
交流電圧測定装置 ^F			交流電圧測定装置校正 マニュアル(CQA1-08) による校正 Fluke 5700A
1kHz	0.022 mV ~ 100 mV	220 μ V/V + 0.022 mV	
1kHz	100 mV ~ 1 V	100 μ V/V + 0.10 mV	
50Hz	1 V ~ 10 V	100 μ V/V + 1.0 mV	
60Hz	1 V ~ 10 V	100 μ V/V + 1.0 mV	
400Hz	1 V ~ 10 V	90 μ V/V + 0.9 mV	
1kHz	1 V ~ 10 V	90 μ V/V + 0.9 mV	
20kHz	1 V ~ 10 V	150 μ V/V + 1.5 mV	
1kHz	10 V ~ 100 V	100 μ V/V + 10 mV	
1kHz	100 V ~ 600 V	110 μ V/V + 62 mV	

- この認定範囲を含む校正に対して記載された CMC (校正測定能力) は、ほぼ理想的な条件下でほぼ理想的な機器をおおよそ定められた方法で校正している試験所であれば、達成しうる最小測定不確かさを表している。それは、包含係数 $k=2$ を用いて 95% の信頼水準で表される。校正されている機器の能力や性能及び校正に関連する条件は、適度にある程度理想から逸脱しうるので、試験所が行っている特定の校正に関する実際の測定不確かさは、通常同じ校正に対する CMC より大きい。
- 校正を認定する場合、校正機関の校正能力の範囲は校正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小値から最大値に起因される。従って、校正範囲の最低下限は校正機関が入手できる最低到達可能値でなければならない。
標準がない場合、手順や方法によって校正された 0 (ゼロ) の値を検証することによって、“0 点は校正ではない” とする定義を除けば、校正方法は手順に起因する。ただし、この場合、0 点の校正が全くできないとする定義は成立しないこともある。
- 上付き文字 “F” は、試験所が固定された位置で示されたパラメータの校正を実行することを意味している。(例: “Outside Micrometer”) は、試験所が固定された位置でこの校正を行うことを明確にしている。)